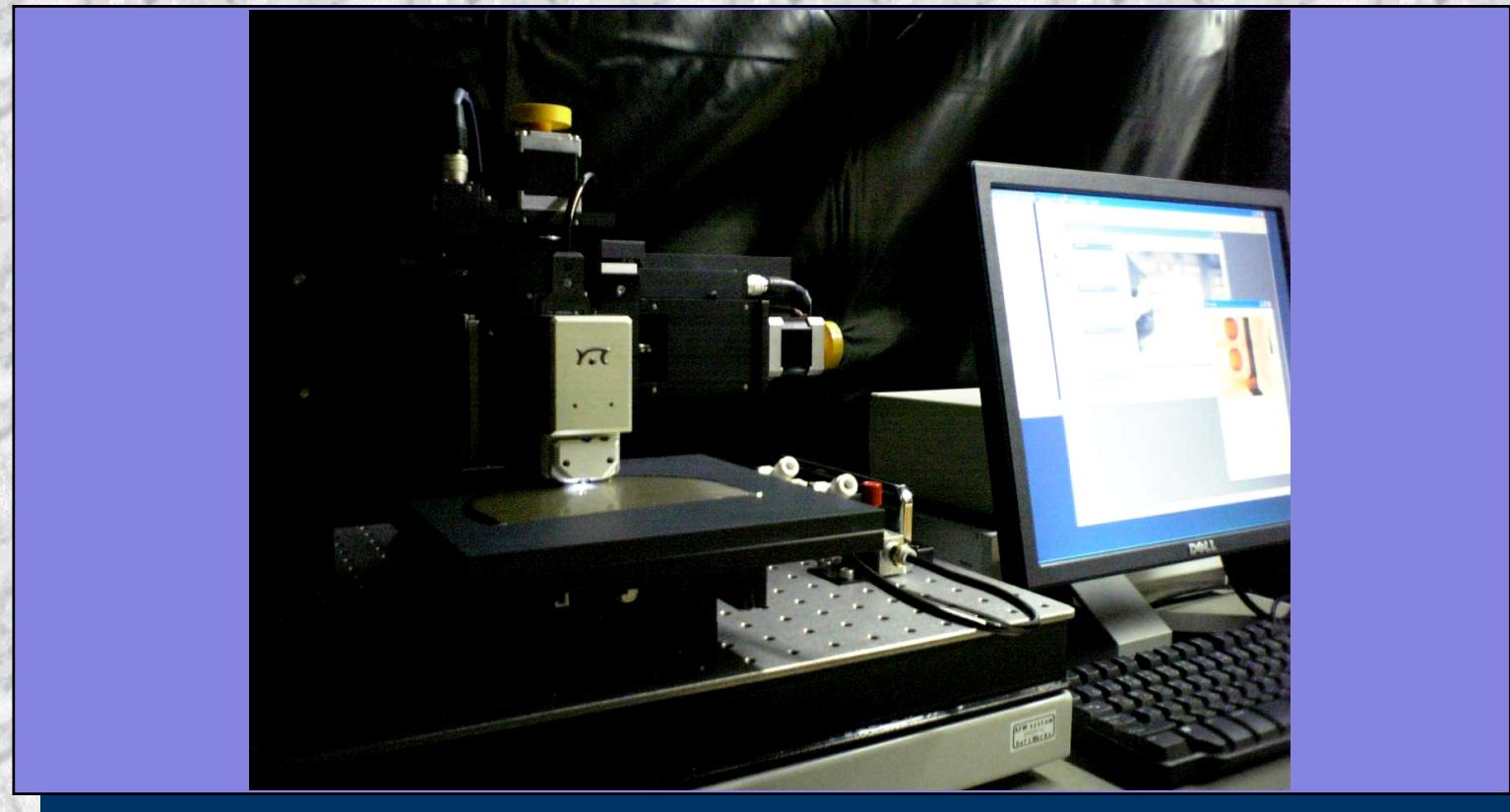




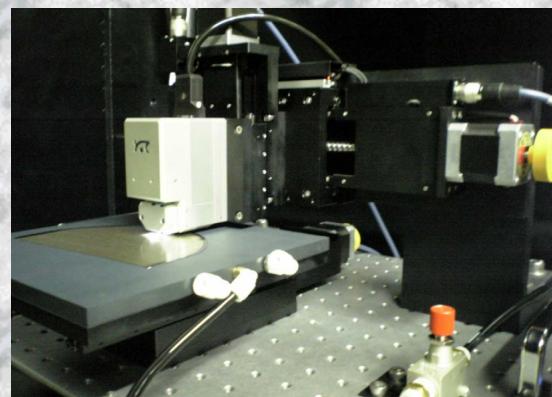
ステージ付きAFM



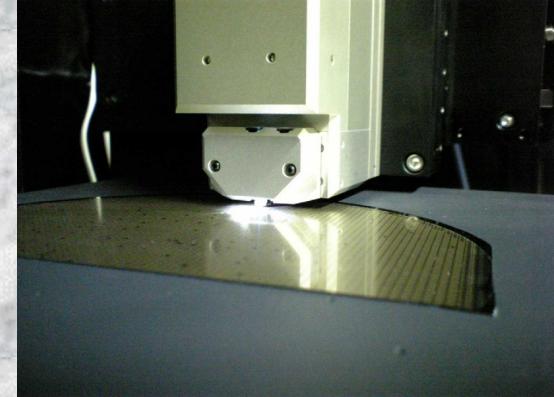
2008/9/18

概要

- SEMに変わる測定方式で、測定ワークにダメージを与えず、正確な3次元測定が可能になりました。
- 大型ステージ付きで、ワークを切斷することなく、サンプルをセットするだけで非破壊で測定可能です。測定モードも多種用意されており、高価なAFM装置と同等の機能を有します。
- 測定ワークの材質に関係無く、導体から絶縁体迄、コーティング無しで、ナノレベルの測定が直ぐに可能です。



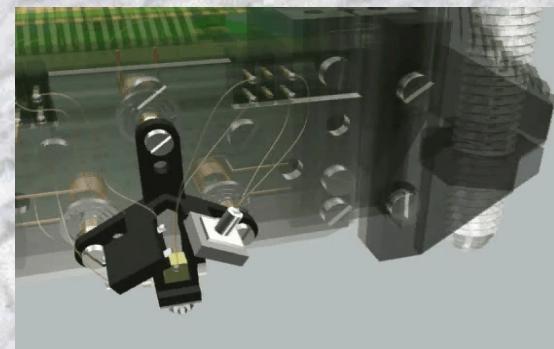
2008/9/18



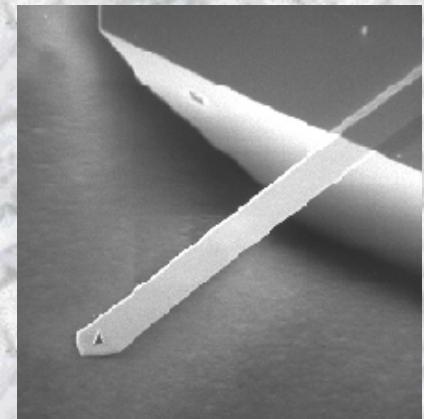
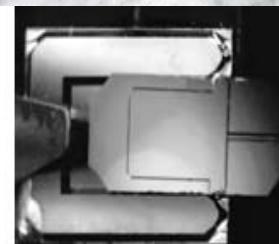
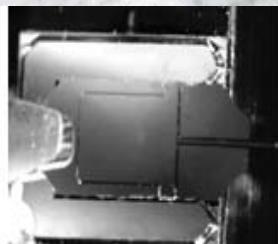
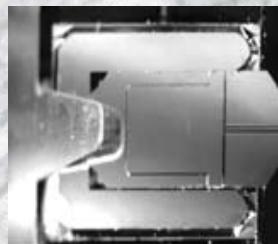
2

機能と特長

- 一般的なピエゾ素子を使用せず
AFM本体部に走査ステージを
内蔵することにより外乱、
に大変強くなっています。



カンチレバーの交換はクイックリリースメカニズム
により、初めての方でも短時間にて可能です。交換
後のキャリブレーションは、本体が自動で行う為、
調整を全く必要といたしません。



機能と特長

- 2方向の小型カメラを本体に内蔵することにより、上方、側面の観察がリアルタイムで可能です。



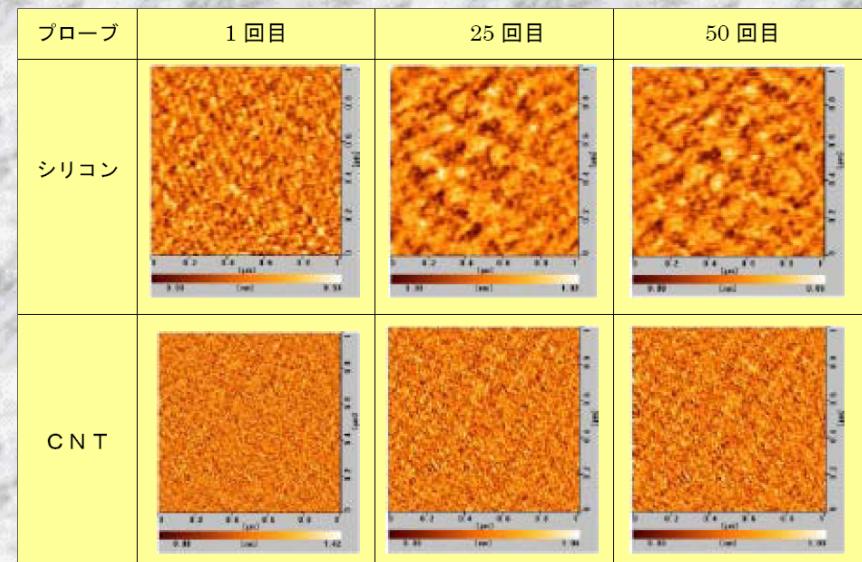
機能と特長

- 走査ヘッドは2種類有り、
高精度タイプと、
広域スキャンタイプからなり、
ソフトウェアは共通で、
ヘッドの交換時間も数秒で、
完了いたします。
測定したい、精度により
容易に交換可能です。



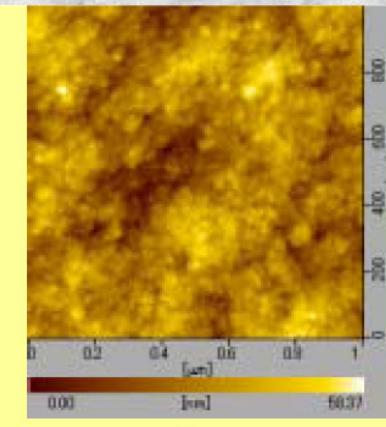
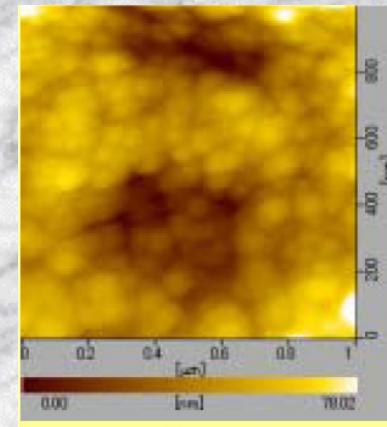
カーボンナノチューブプローブ

- カーボンナノチューブプローブを含む、全てのカンチレーバーでオートアップローチが可能となっております。

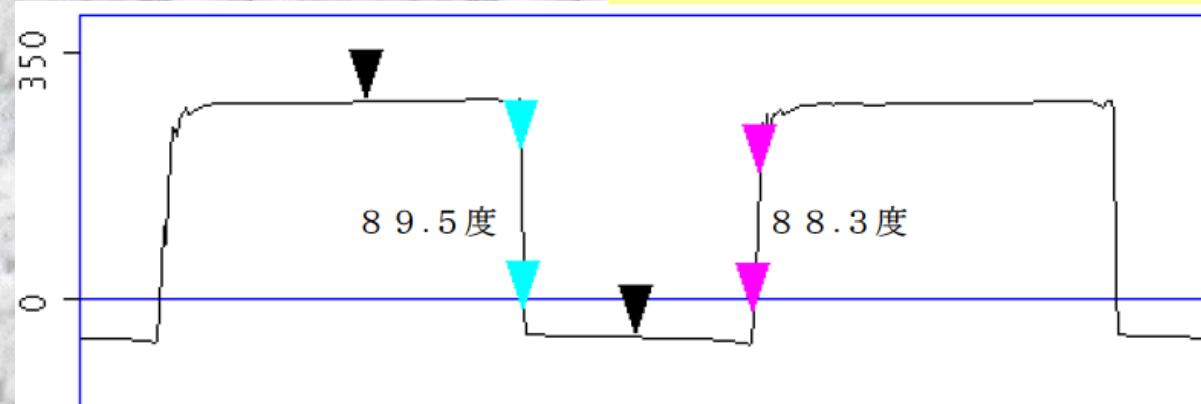


カーボンナノチューブプローブ

- ご希望により、
カンチレバーの
長さ、幅の指定
製作が可能です。



高分解能測定例：サンプル－炭素系超微粒子



垂直サンプル測定例：500 nm ピッチ深さ340 nm

仕様

走査ヘッドタイプ	広域スキャン	高精度スキャン
最大スキャンレンジ	110 μm	10 μm
最大 Z-レンジ	22 μm	1.8 μm
分解能 Z方向	0.34 nm	0.027 nm
分解能 XY方向	1.7nm	0.15nm
XY-リニアリティエラー	<0.6%	<0.6%
Z 測定ノイズレベル (RMS, ダイナミックモード)	0.3 nm (max. 0.54 nm)	0.04 nm (max. 0.07 nm)
2008/9/18		

測定モード1

- スタティックフォース
- ダイナミックフォース
- フェイズコントラスト
- フォースモジュレーション
- マグネティックフォース
- スプレッディングレジスタンス
- モード； ユーザー信号が全てのモードで
使用可能モードによって最高5点の測定
チャンネル

測定モード2

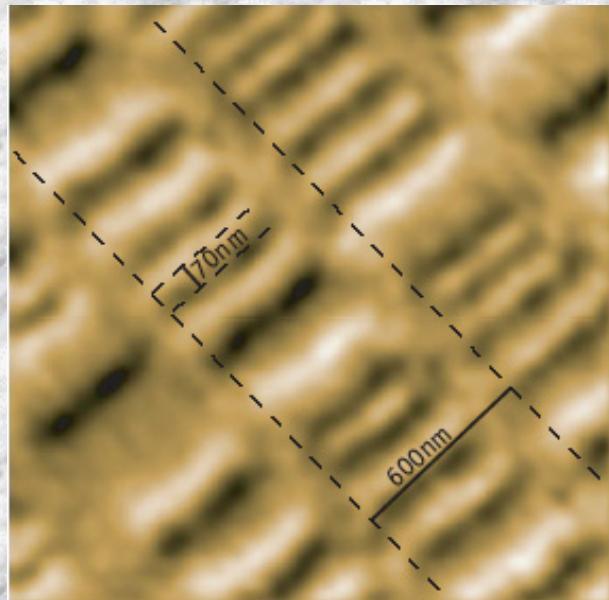
- 走査エリアとデータ点数
幅と高さは個別に最高 2048×2048 点
- 走査モード 順方向と逆方向走査
フレームUP、DOWN、又は連続
- 走査画像回転 $0 - 360^\circ$
- サンプルの傾斜補正
ハードウェアのXY傾斜補正

MFMモード

- 磁気力顕微鏡(MFM)
- Magnetic Force Microscopyとは、プローブ顕微鏡の一種であり、表面の微小磁区を測定する事ができる測定法で、カンチレバーに磁性材料を蒸着した物を使います。
- 試料表面付近では原子間力の影響が大きく走査プローブ顕微鏡の中でも難しい測定になります。

MFMモード

- 測定例ここで示される寸法は、サンプルは、10GB
3. 5インチハードディスクで、600nmのトラック距離
による媒体の平面と70nmのビット長で磁気を帶た
42KのTPI、363KのBPIと一致します。



2008/9/18

12

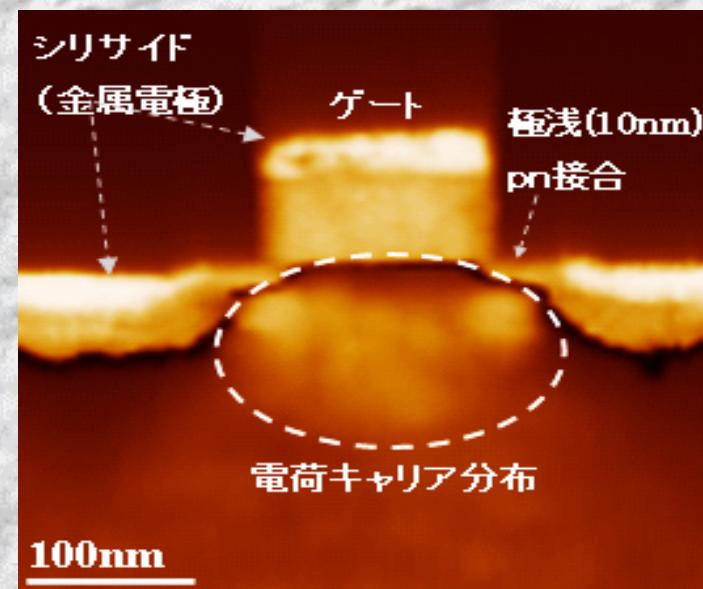
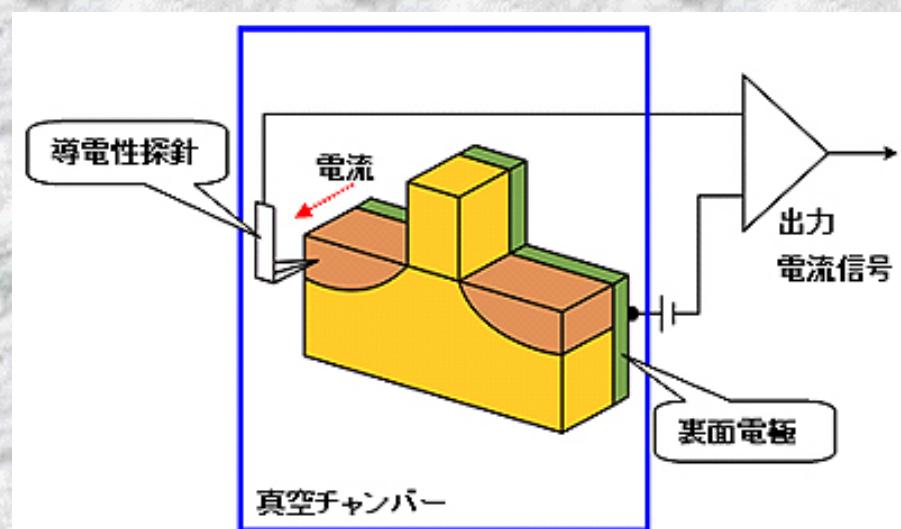
Spreading Resistanceモード

- 広がり抵抗顕微鏡 (SSRM)
Scanning Spread Resistance Microscope
試料に電圧を印加し、導電性プローブを通して流れる電流を対数アンプによって計測し、抵抗分布を得ます。
電圧が探針直下に集中するため、探針直下でのドーパント濃度が支配的な電流（広がり抵抗）を検出することが可能です。
接触抵抗を減らすため、カンチレバーに高い針圧をかけて測定します。これによりキャリア濃度に合致した抵抗値が得られます。

Spreading Resistanceモード

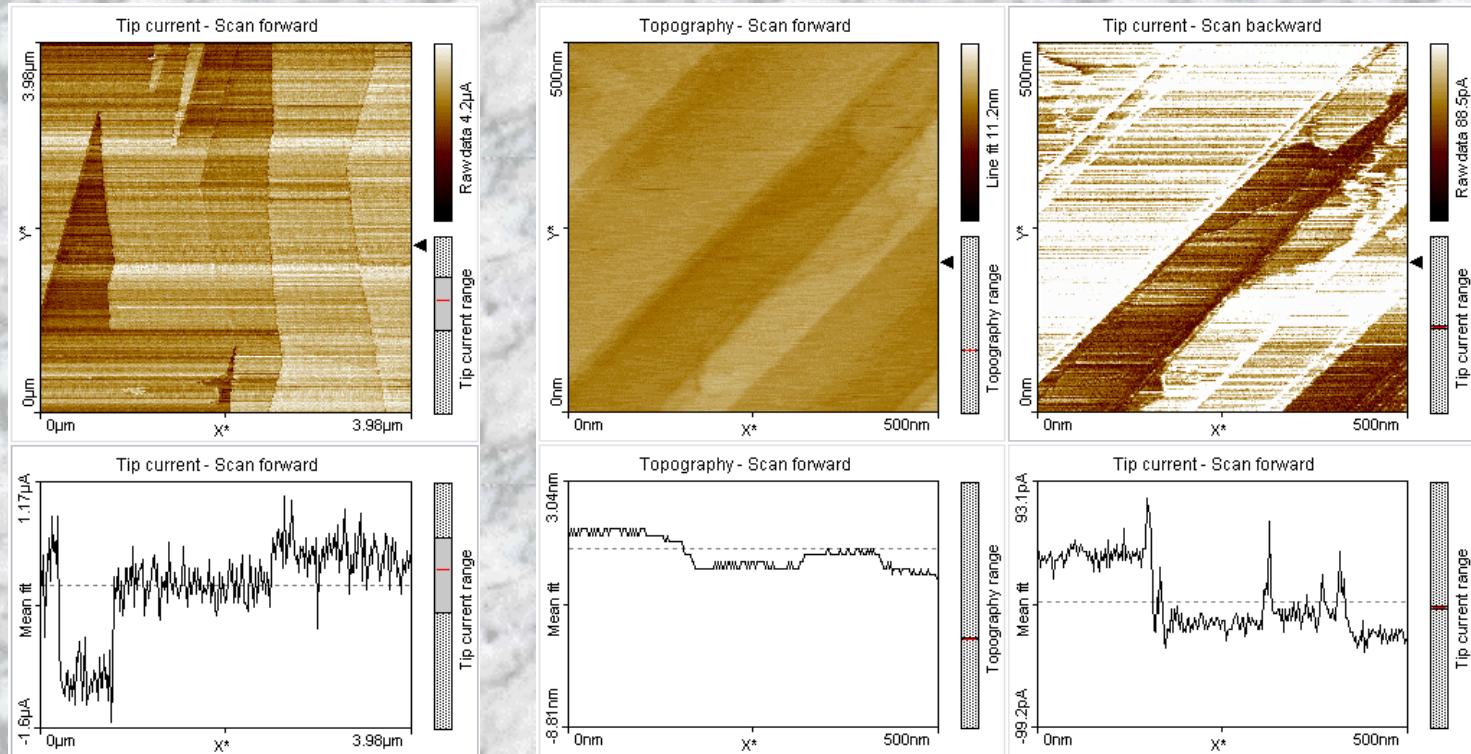
■ 参考図

半導体ドーパント濃度分布の評価
測定レンジが不足するような広い範囲の電
気抵抗の違いを捉えることが可能です。



Spreading Resistanceモード

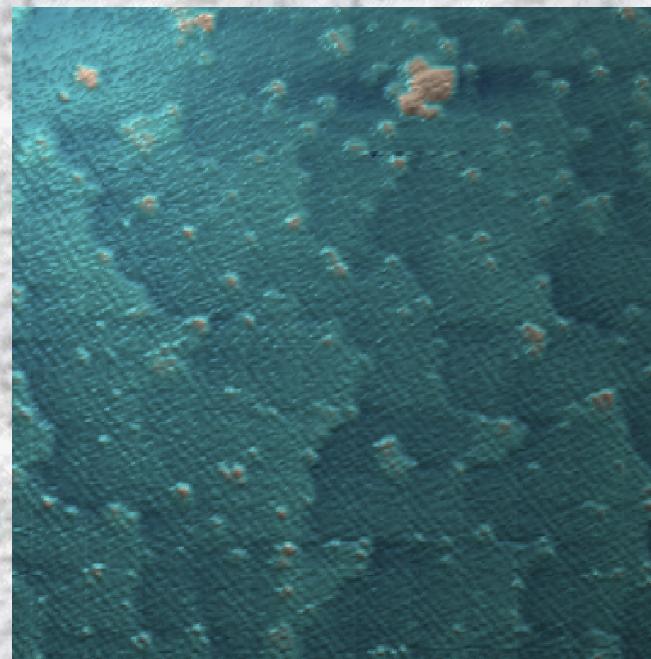
■ 測定例



アプリケーション

■ 測定例

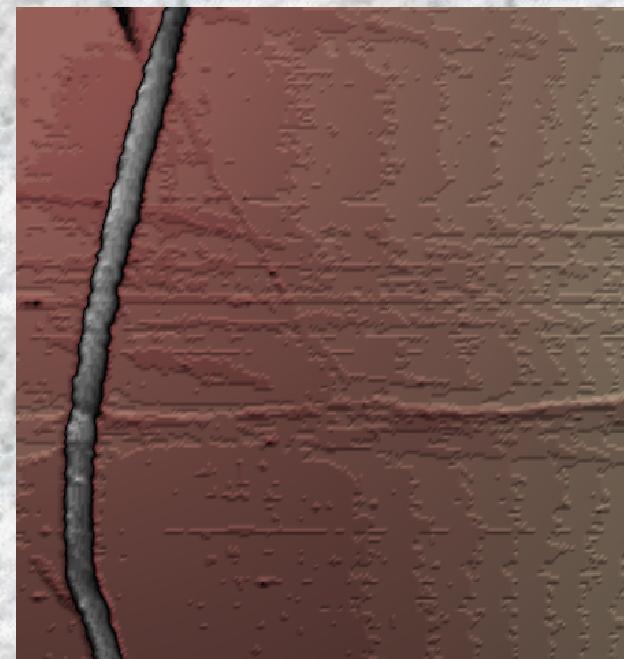
シリコンウェハー



10x10 μm image, z-range: 38.8nm

University, EKM, Experimentalphysik 6.

カーボンナノチューブ



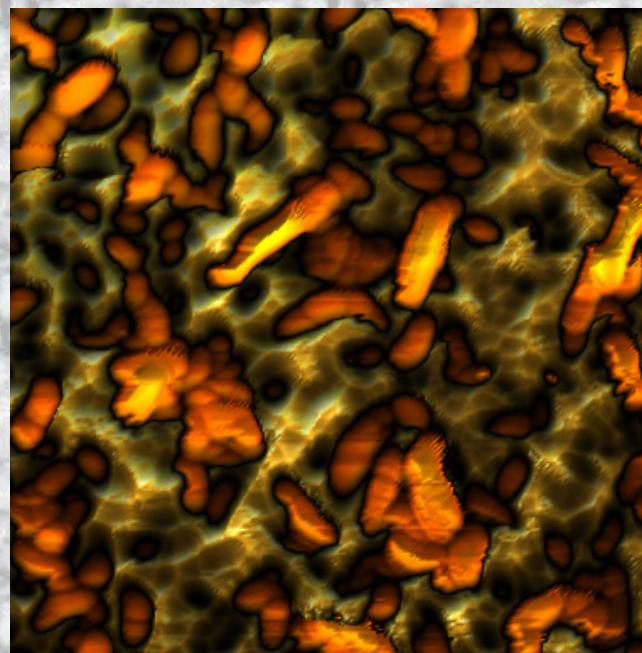
Scan size 500 × 500 nm; Z-range: 6 nm

Alexandru Darabont at the University

アプリケーション

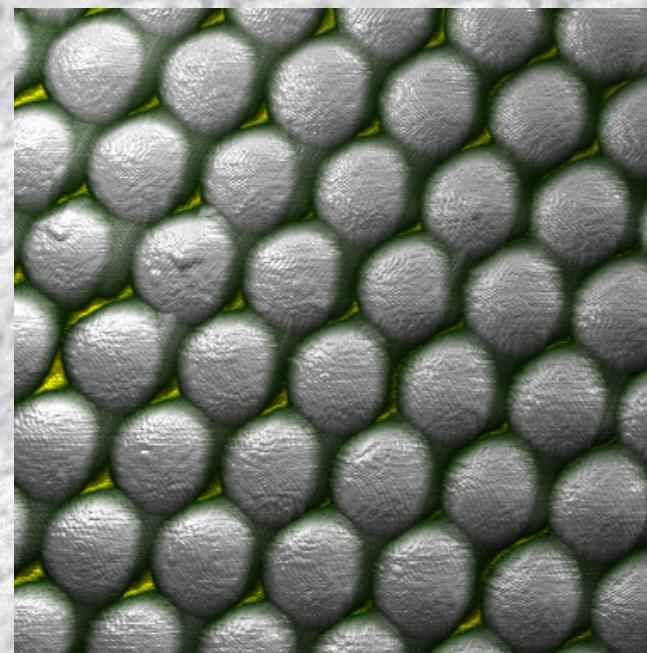
■ 測定例

ソーラセルレイヤー



Scan range 90 μm x 90 μm ; Z range 7.6 μm

リソグラフィー

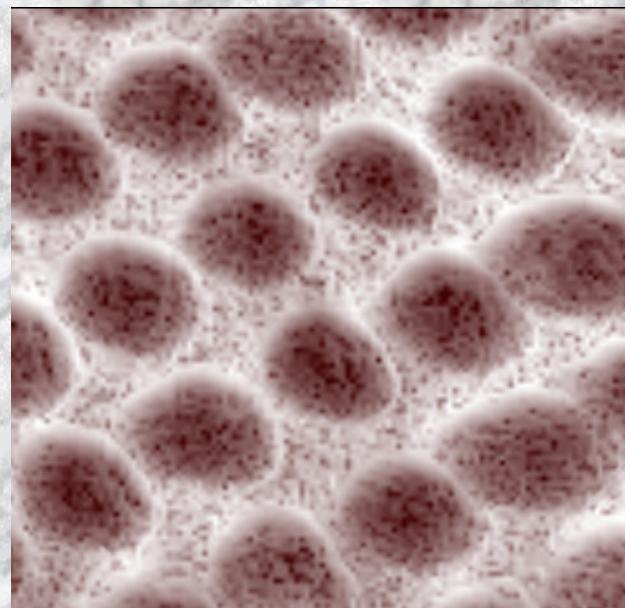


5x5 μm image, z-range: 200nm
National Taiwan Ocean University

アプリケーション

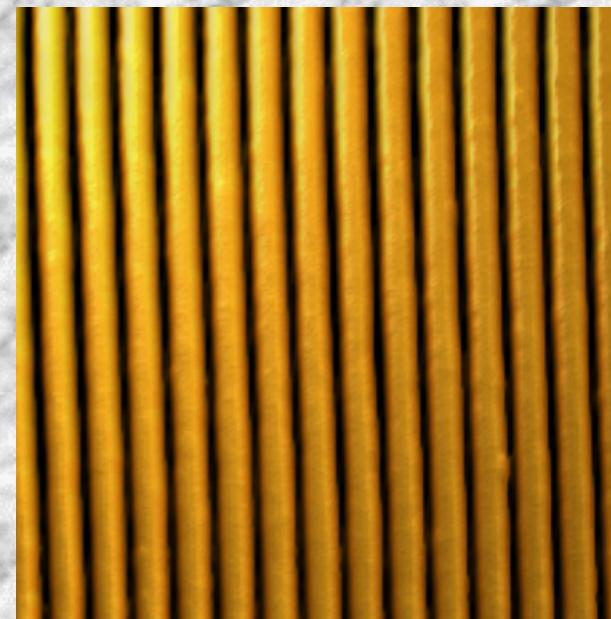
■ 測定例

ナノグリッド(金薄膜上の樹脂)



500x500nm image; z-range 27nm
Laboratory for Micro- and Nanotechnology

光配線格子



10x10μm image, z-range: 500nm

アプリケーション

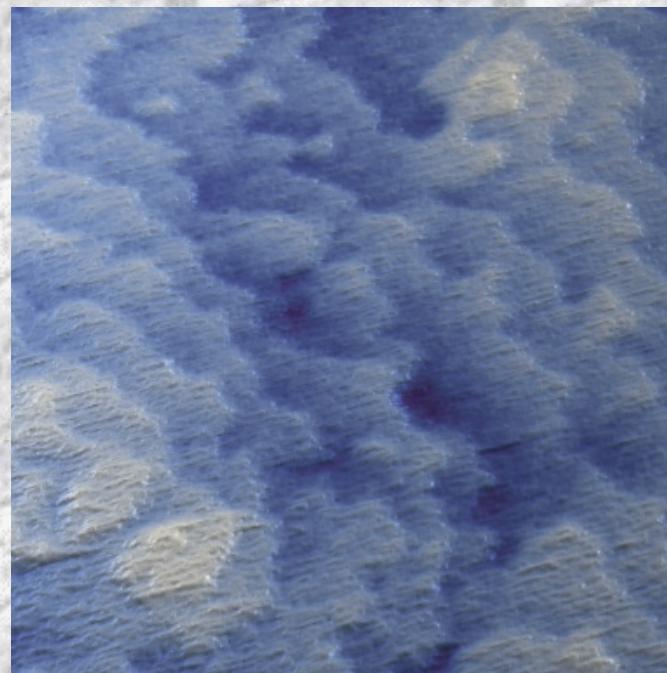
■ 測定例

量子ドット



1x1 μm image, z-range: 3nm

ストロンチウム薄膜



2 μm x 2 μm ; z-range 2.5nm

アプリケーション

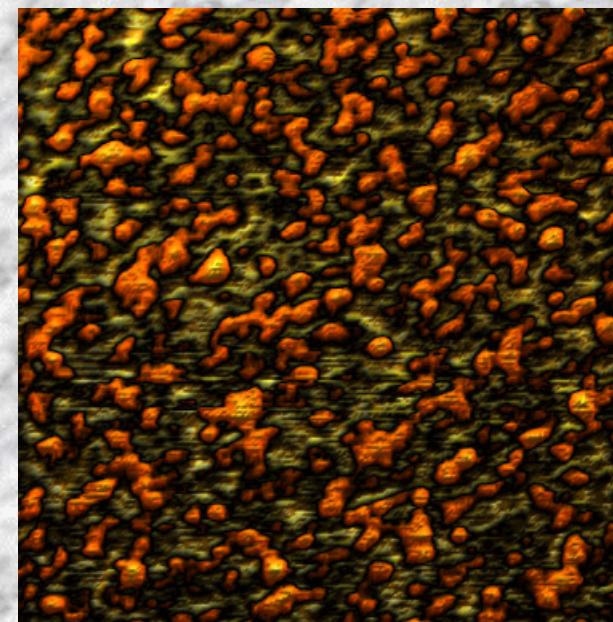
■ 測定例

光学レンズ表面



1x1 μm image, z-range: 0.8nm

ニュートンミラー

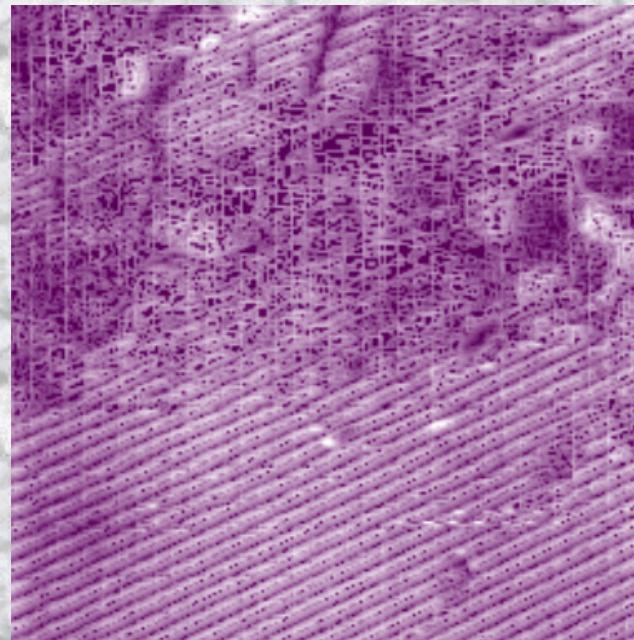


2 μm x 2 μm ; Z range 7nm

アプリケーション

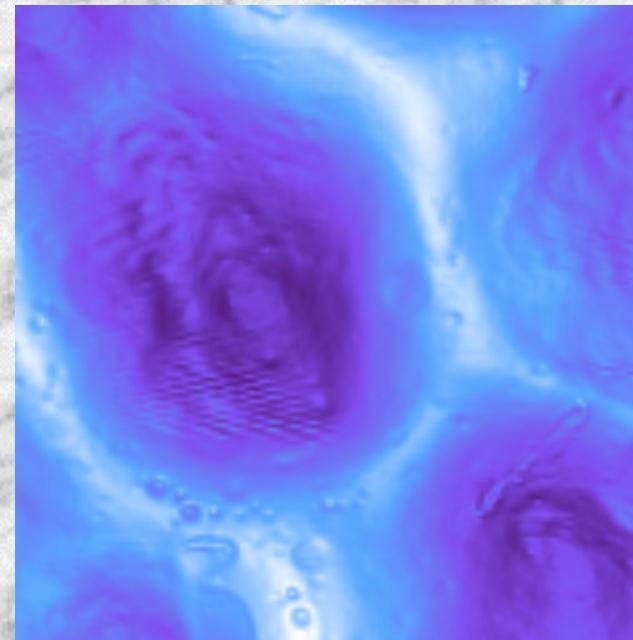
■ 測定例

Bioチップ



50x50 μm image, z-range: 150nm

ステント面

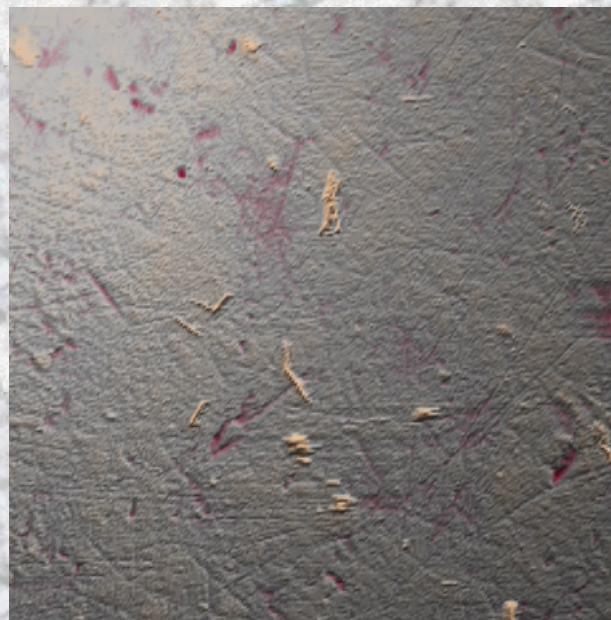


20x20 μm image, z-range 2.3 μm

アプリケーション

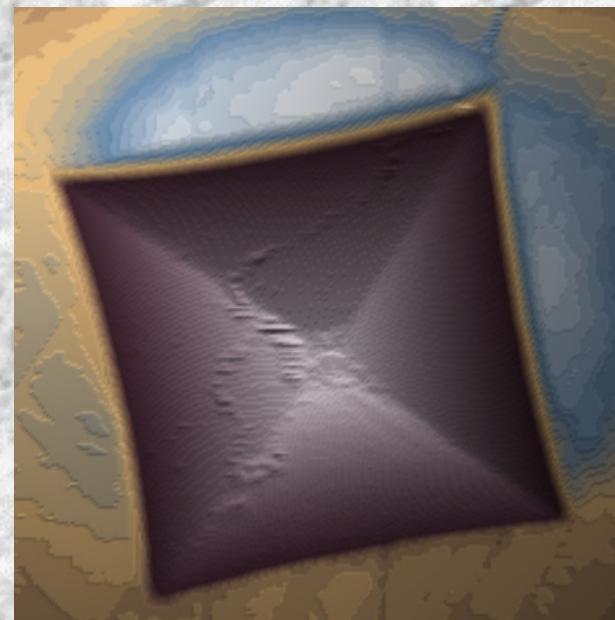
■ 測定例

タンクステンカーバイトボール



10x10 μm image, z-range: 30nm

ステンレスインデット

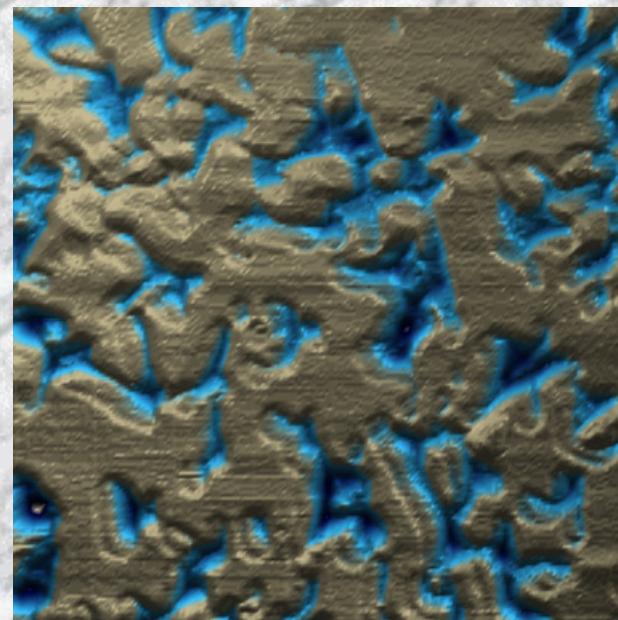


80x80 μm image, z-range: 6 μm

アプリケーション

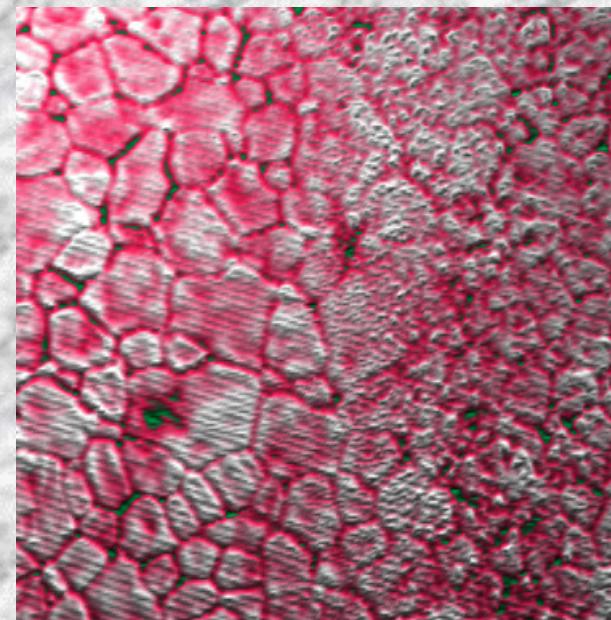
■ 測定例

炭化ケイ素薄膜



5x5 μm image, z-range: 110nm

金フィルム粗さ



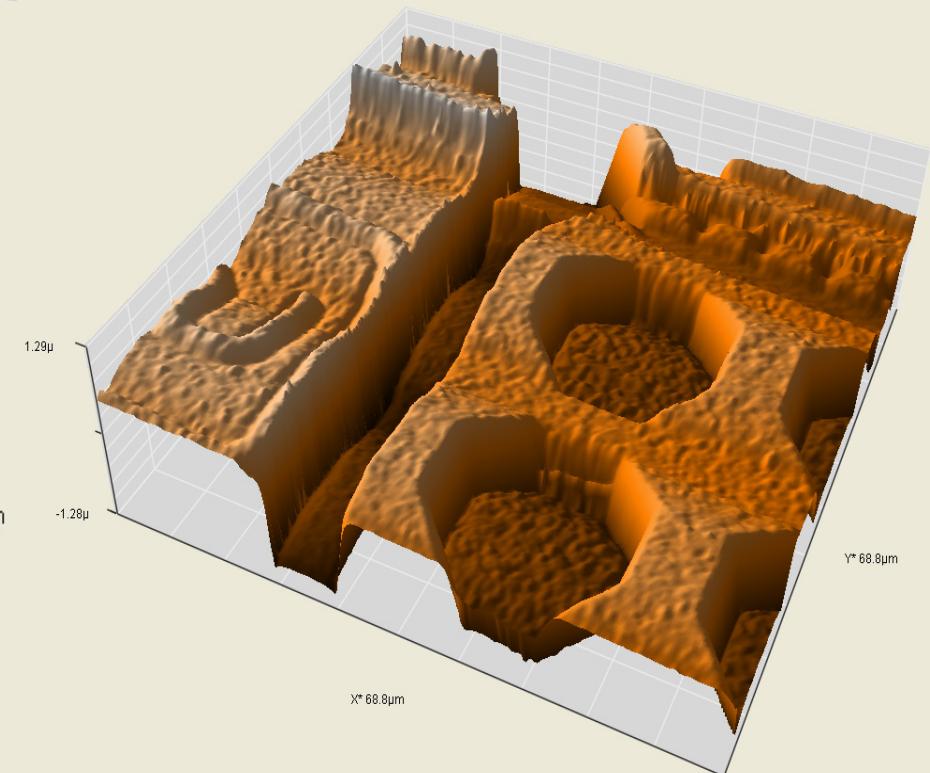
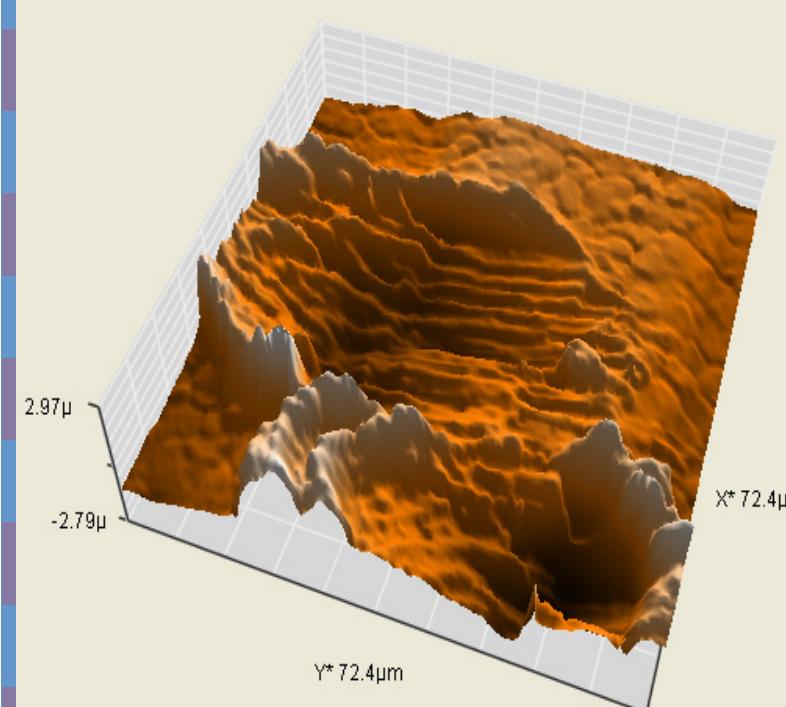
40x40 μm image, z-range: 200nm

アプリケーション

測定例

パットのプローブ痕

ICパターン



Report

■ レポート作成

標準の各種解析ツールの他、
視覚的に魅力的な、専門の
レポートの作成のために
ソフトウェアをオプションとして
準備しております。
測定ソフトウェアの中に組み込まれ、
測定分析を含んで、テキスト
コメント、ロゴ、タイムスタンプ
とイメージを
作成し報告します。



語句解説

TPI

磁気記録メディアや光学記録メディアにおいて、記録トラックの密度を表す単位。... 例えば 135 tpi といえば (これは 3.5 インチ・フロッピー・ディスクの記録密度)、1 インチあたり 135 本の記録トラックがあるという意味になります。

BPI

磁気テープ記憶装置の記録密度をあらわす単位。テープの長さ1インチあたりに何ビットの情報を記録できるかを表します。

有難うございました。

- 現在 3 台のデモ機を用意しております。
お気軽にサンプルテスト申しつけ下さい。
超アスペクト比のカーボンナノチューブプローブ
も、取り扱っております。（特注も可能です）
また、AFMと顕微鏡、厚さ計、など含めた複合
装置も、製作しております。

姉妹機を含めワールドワイドで、毎年 100 台以上
の確かな納入実績が有ります。

貴重なお時間有難うございました。

連絡先

<http://www.softworks.co.jp/>

会社情報

会社名 ソフトワークス株式会社

所在地 浜松本社／〒433-8119 静岡県浜松市中区高丘北1丁目40番15号
TEL(053)439-8960 FAX(053)439-5561



東京営業所／〒103-0027 東京都中央区日本橋3-2-14号
日本橋KNビル4階
TEL(03)6214-1525 FAX(03)6214-1526

代表者 塩見俊夫

設立 平成3年7月1日

資本金 1,525万円

業務内容 コンピュータソフトウェアの開発および販売

取引銀行 静岡銀行 三方が原支店
浜松信用金庫 高丘支店